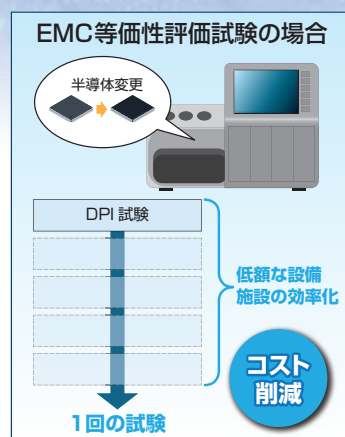
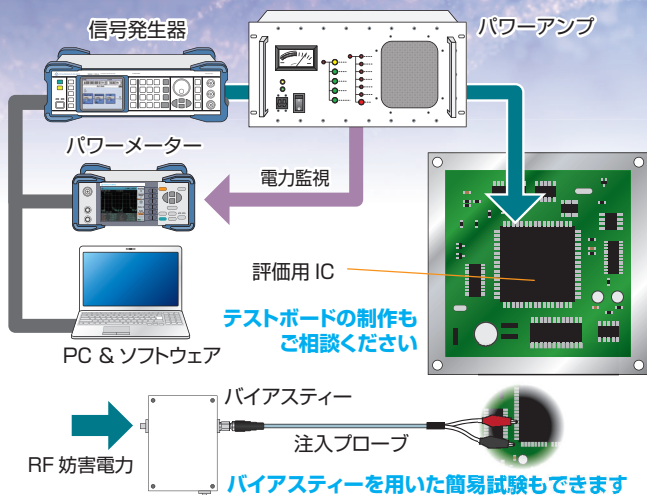


EMC試験の工数削減

DPIイミュニティ試験

半導体EMC性能等価性評価で試験工数を削減

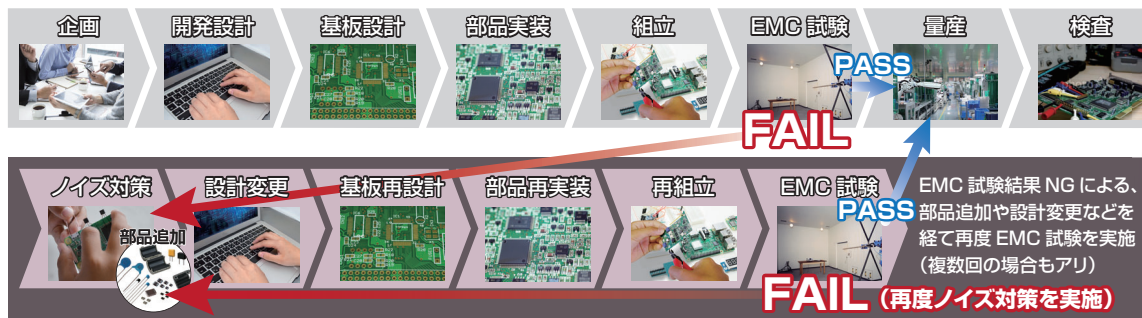
本システムは、半導体(IC)にRF妨害電力を直接注入し、イミュニティ耐性を評価する試験システムです。製品に利用される半導体が変更になった際、本試験を実施して等価性の証明ができれば、製品性能は同等と見なすことができ、EMC試験を免除することができます。



【活用事例】製品開発にDPI試験を組み込み工数削減

DPIイミュニティ試験を製品開発プロセスに組み込みことにより、誤動作の主要因となりうる半導体製品(IC)を定量的に評価することで、EMC対策の工数削減が見込めます。

■ 従来の製品開発プロセス



■ DPI イミュニティ試験を組み込んだ場合

